

2025年 第135回触媒討論会

日本カンタム・デザイン ランチョンセミナー

Analytical Uses of X-ray Absorption Fine Structure for Improved
Characterization of Catalysts in Academia and in Industry

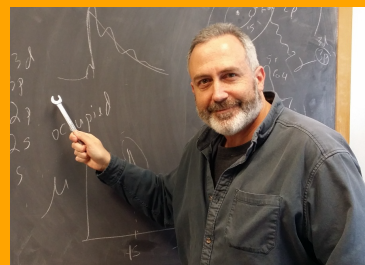
学術および産業分野における触媒特性評価の高度化に 向けたX線吸収微細構造（XAFS）の分析的応用

日時：2025年9月17日（水）12：10 ～ 12：50

会場：触媒討論会H会場（青葉山コモンズ2F 第4講義室）

講演者：Gerald Seidler（使用言語：英語）

（easyXAFS社共同創設者、ワシントン大学教授）



〈セミナー概要〉

本セミナーでは、新規および使用済み触媒の既存のルーチン分析を実験室ベースのXAFSによってどのように改善できるかを検討します。

XAFSの基礎から触媒事例までをわかりやすく解説し、ルーチン分析への活用方法を議論します。

easyXAFSは放射光品質の測定を実験室で可能にし、専門知識なしで定性的・校正的評価を実現。

〈easyXAFS社について〉

2015年に実験室XAFSの再興を開始し、放射光品質のスペクトルを即時に取得可能とすることを目指しました。現在までに世界中の学術研究グループに130台以上の分光器を提供しております。



Niche specialist technique



Standard analytical tool